

MOA-ZA

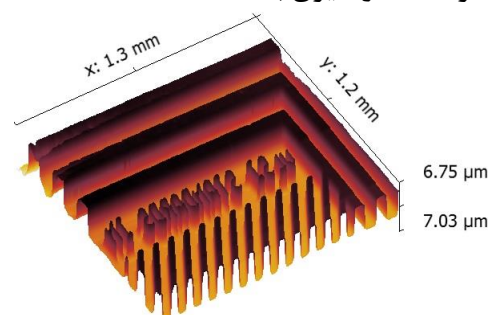
بررسی زبری و توپوگرافی سطح اجسام دقت ۵ نانومتر

پنجره اسکن : ۲,۶ الی ۳,۵ میلی‌متر

دقت اندازه‌گیری : ۵ نانومتر در راستای Z و ۲,۱ میکرومتر X , Y

دامنه Z : ۴۰ نانومتر الی ۸ میلی‌متر

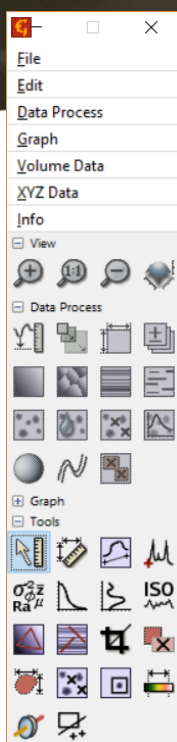
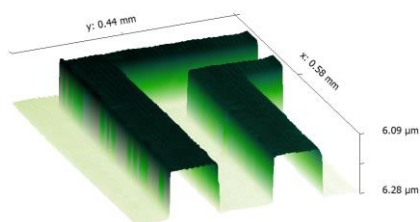
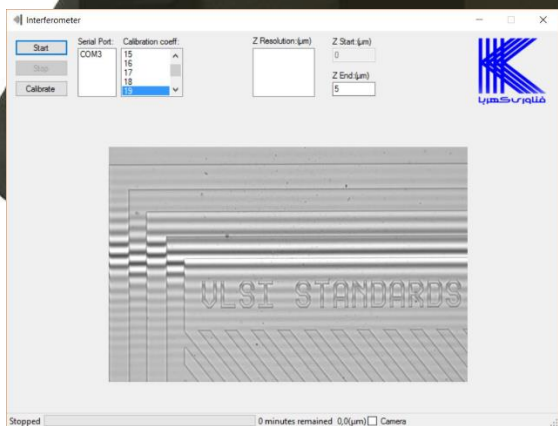
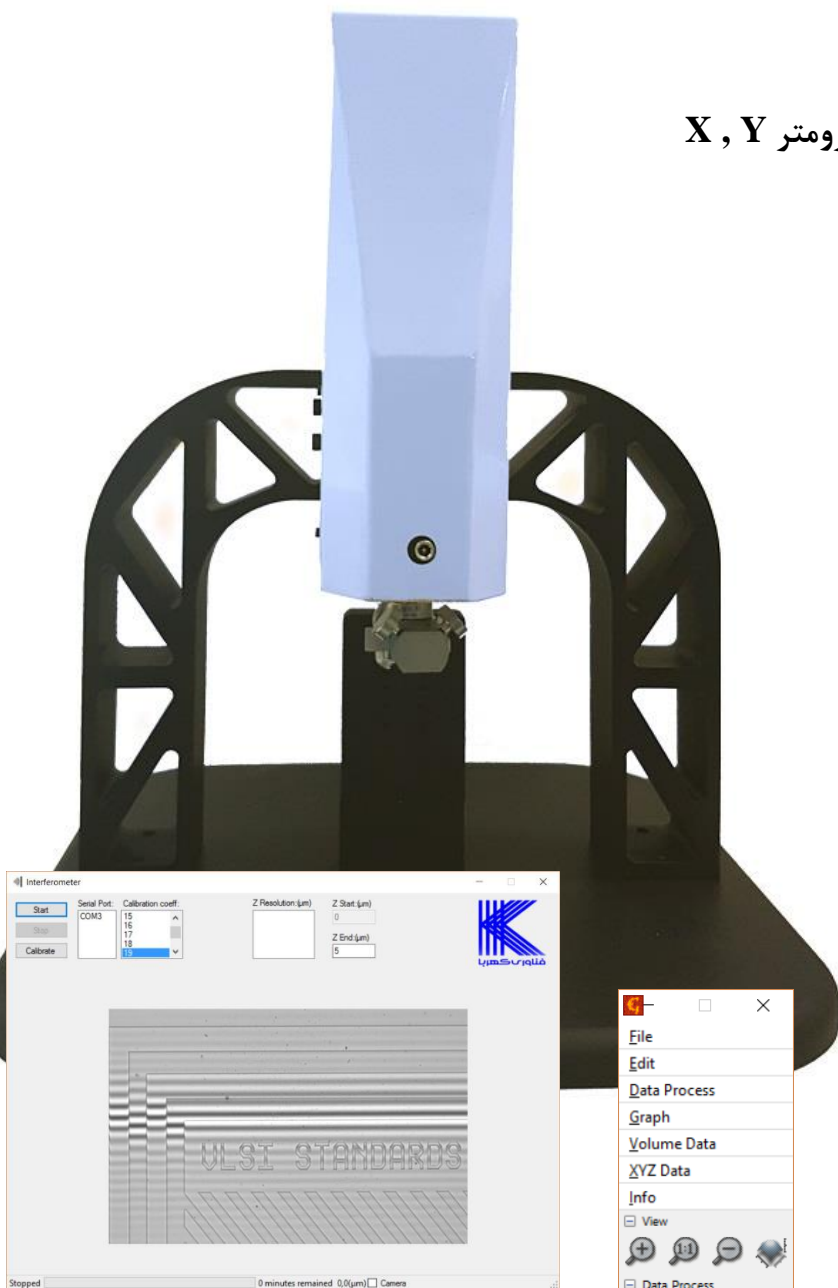
- ❖ اندازه‌گیری توپوگرافی سطح با دقت نانومتر
- ❖ توانایی اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع ۱۰ میلی‌متر
- ❖ توانایی اندازه‌گیری ضخامت ، زبری ، پروفایل و ...
- ❖ امکان نمایش در نرم‌افزارهای پروفیلومتری
- ❖ سرعت اندازه‌گیری بالا



بازه اندازه‌گیری این روش از مرتبه نانومتر تا میلی‌متر است .
دقت اندازه‌گیری در این روش وابسته به همدوسی منبع نور ،
دقت و تکرارپذیری استیج عمودی ، مقاومت در برابر لرزش ،
بازتاب‌پذیری و زبری سطح نمونه و خطای سنسور CCD است .
با در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها دستگاه MOA-ZA دارای
دقت ۵ نانومتر است .

طرح تداخلی ایجاد شده بر اثر اختلاف راه در پستی بلندی‌های
نمونه دچار شکست می‌گردد . از تحلیل این شکست‌ها توسط
نرم‌افزار می‌توان پروفایل سطح را به دست آورد . نرم‌افزار
دستگاه امکان تعیین رزولوشن در راستای عمودی ، نقاط شروع
و پایان را دارد .

پس از دریافت داده‌ها این اطلاعات توسط نرم‌افزار **gwyddion**
نمایش داده می‌شوند که در این نرم‌افزار با توجه به نیاز می‌توان
به بررسی زبری ، ارتفاع پوشش ، شکل جسم و ... پرداخت .



تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،

ساختمان شماره ۲، واحد ۳۱۰، شرکت فناوری کهربا

کدپستی: ۱۴۲۹۸۱۳۱۴۴

تلفن: ۰۲۱۸۶۰۹۴۱۰۲ تلفکس: ۰۲۱۸۶۰۹۳۲۰۵

fanavari.kahroba@gmail.com

www.fanavari-kahroba.com